

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 120490

УСТРОЙСТВО ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЛЕНОК

Патентообладатель(ли): *федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" (RU)*

Автор(ы): *см. на обороте*

Заявка № 2011154657

Приоритет полезной модели 30 декабря 2011 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 20 сентября 2012 г.

Срок действия патента истекает 30 декабря 2021 г.

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

Б.П. Симонов



A handwritten signature in black ink, appearing to read "B.P. Simonov".



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

(21), (22) Заявка: **2011154657/28, 30.12.2011**(24) Дата начала отсчета срока действия патента: **30.12.2011**

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: **30.12.2011**(45) Опубликовано: **20.09.2012**

Адрес для переписки:

**199106, Санкт-Петербург, В.О. 21 линия,
2, ФГБОУ ВПО "Национальный
минерально-сырьевой университет
"Горный", отдел интеллектуальной
собственности и трансфера технологий
(отдел ИС и ТТ)**

(72) Автор(ы):

**Федорцов Александр Борисович (RU),
Иванов Алексей Сергеевич (RU),
Гончар Игорь Валерьевич (RU),
Манухов Василий Владимирович (RU)**

(73) Патентообладатель(и):

**федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
"Национальный минерально-сырьевой
университет "Горный" (RU)**

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЛЕНОК

Формула полезной модели

Устройство для неразрушающего измерения толщины диэлектрических и полупроводниковых пленок, содержащее источник монохроматического излучения, держатель образца, вращающееся плоское зеркало, ось вращения которого расположена на его отражающей поверхности, и приемник излучения, который подсоединен к регистрирующему устройству, первое сферическое зеркало, установленное так, что точка, оптически сопряженная с точкой образца, в которой производится измерения, находится на оси вращения плоского зеркала, в месте падения на него излучения источника, и второе сферическое зеркало, установленное с возможностью оптического сопряжения точки образца, в которой производятся измерения, и приемной площадки приемника излучения, при различных угловых положениях плоского зеркала, отличающееся тем, что, с целью повышения точности измерений, устройство для неразрушающего измерения толщины диэлектрических и полупроводниковых пленок дополнительно содержит маркер, прерывающий падение лазерного луча на образец под фиксированным углом

